# 金電極表面上におけるナフィオン吸着・脱離過程

(<sup>1</sup>物質・材料研究機構、<sup>2</sup>北海道大学)○増田卓也<sup>1</sup>、池田幸択<sup>2</sup>、

魚崎浩平1,2

【緒言】固体高分子形燃料電池は、比較的低温で動作し、小型軽量で高い出力密度が実現されるため、自動車や家庭用電子機器の次世代電源として期待されている。主要な構成要素は、 イオン伝導性を有する高分子電解質膜の両面に触媒層を接合した膜・電極接合体

(Membrane-electrode assembly; MEA) と呼ばれるものである。この中で電池反応の場となる 触媒/電解質界面の構造は、酸素還元活性、担体の腐食、Pt 粒子の溶出・凝集、反応物・生 成物・プロトンの拡散/伝導に影響を与えることが予想され、性能や耐久性を支配する重要 な因子であると考えられる。したがって、界面構造を明らかにすることは PEFC の高性能化 を図る上で極めて有用である。特に、電池出力の決定因子である電気化学活性表面積は、電 極表面への電解質の吸着・脱離挙動と密接に関連しており、これを理解することで触媒や電 解質膜の新たな設計指針が与えられものと考えられる。

現在、高分子電解質膜として、高いプロトン伝導性・水移動性と、比較的高い安定性を 持つことから、パーフルオロスルホン酸系ポリマーが利用されている。中でも、図1に示す ナフィオンは、最も代表的なもので古くから構造・物理特性の両面で研究が進められている [1]。本研究では、燃料電池の心臓部である MEA のモデル系として、ナフィオン/金電極界 面で起こる化学プロセスを、特に電位依存吸着・脱離過程に注目して、水晶振動子マイクロ バランス法(QCM)、および原子間力顕微鏡(AFM)によりその場観察した。



図1ナフィオンの化学構造式.

【実験】金(111)単結晶電極を水素炎アニールしたのち、ナフィオン水溶液中において、サイ クリックボルタモグラム(CV)、電気化学 QCM および AFM 測定を行った。また、硫酸水 溶液中において同様の測定を行った。金電極の硫酸水溶液中における電位依存構造変化につ いては、イオンの吸着・脱離も含め、これまでにかなりの部分が原子レベルで明らかとなっ ている[2]。両者の結果を比較することによって、ナフィオンの金電極への吸着・脱離挙動を 明らかとする。なお、QCM 測定では単結晶電極を用いることができないので、アニールお よび酸化還元サイクルによる清浄化処理を行った多結晶金電極を用いた。

【結果】図2に金(111)電極の(a) 硫酸および(b) ナフィオン水溶液中における CV を示す。硫酸中では、過去の報告と同様に、0.4 V 付近に表面再配列構造のリフティング、アニオン吸着に対応する電流変化、0.9 V 付近に吸着アニオンの相転移に対応するスパイクが観察された[2]。電位をさらに正電位まで走査すると、1.3 V 付近に金酸化物形成が、電位を折り返して、-0.9 V 付近に酸化物の還元ピークが観察された。

ナフィオン中においても、IR ドロップによるゆがみは見られなかった。このことより、 ナフィオンのみを溶解させた状態で電気化学測定が可能、つまり、ナフィオンが水溶性電解 質として働くことが示された。ナフィオン中での CV の形状は、硫酸中とよく似たものとな っている。再配列構造のリフティング、アニオン吸着およびその相転移、金酸化物の形成お よび還元に対応すると考えられる電流変化が、硫酸中とほぼ同じ電位で観察された。このこ とは、ナフィオンにおけるスルホン酸基が、硫酸中における硫酸アニオンと同様のはたらき を持つことを示している。

また、AFM および QCM の結果から、スルホン酸基と硫酸アニオンが金表面上で非常に よく似た吸着・脱離挙動を示すことが明らかとなった。



図23mM (a) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>および(b) Nafion 水溶液中における Au(111)電極サイクリックボルタモグ ラム. 走査速度: 50 mV/s

【参考文献】

[1] K. A. Mauritz, R. B. Moore, Chemical Reviews **2004**, *104*, 4535.

[2] T. Kondo, J. Morita, K. Hanaoka, S. Takakusagi, K. Tamura, M. Takahasi, J. Mizuki, and K. Uosaki, Journal of Physical Chemistry C, 2007, 111, 13197.

# 高速 AFM による構造規制 Pt ナノ微粒子溶解過程のリアルタイム観測

(千葉大院・工) 〇星 永宏・吉田 力・山田雄太・中村将志

【序】 燃料電池の電極触媒である Pt ナノ微粒子は,高電位となる空気極側で溶解 し,燃料電池の活性が低下する。燃料電池の普及のためには,電極触媒の耐久性の向 上が重要である。Pt の溶解には酸化被膜が関連する<sup>1</sup>。Pt 単結晶電極を用いた研究に より,酸化被膜の生成電位は表面構造に大きく依存することが分かっている<sup>2</sup>。した がって,Pt ナノ微粒子の表面に酸化被膜の生成が起こりにくい構造を構築すれば,実 用触媒の耐久性が飛躍的に向上する可能性がある。そのためには,構造規制 Pt ナノ 微粒子の溶解過程を *in-situ* でリアルタイム観測することが重要である。

我々は Pt ナノ微粒子の溶解が遅い中性溶液中で,立方体型 Pt ナノ微粒子の溶解機構を原子間力顕微鏡(AFM)で明らかにした<sup>3</sup>。しかし,燃料電池反応のモデル水溶液は酸性溶液である。酸性溶液中の Pt ナノ微粒子の変化は速く,1 画面の測定に 10 分以上を要する通常の AFM では溶解過程を追跡できない。今回は,1 画面を最速 0.09 s で測定可能な高速 AFM を導入し,電位制御した酸性溶液中で,立方体型および立方 八面体型 Pt ナノ微粒子の溶解過程を観測した。

【実験】 構造規制 Pt ナノ微粒子は,ポリアクリル 酸ナトリウム(PAA)を保護剤とし,塩化白金酸イオン をH<sub>2</sub>ガスで還元して作製した<sup>4.5</sup>。高速 AFM 測定には, 生体分子計測研究所製の Nano Live Vision を用いた。 電解液は空気飽和した 0.1 M HClO<sub>4</sub> である。-0.05~1.6 V (RHE)の電位範囲を 2.0 V s<sup>-1</sup>の速度で掃引しながら, 実構造の変化をリアルタイムで観測した。

【結果と考察】 TEM 測定により,10 nm サイズの立 方体型および立方八面体型 Pt ナノ微粒子が合成され ていることを確認した。図1に電位走査前の立方体型 Pt ナノ微粒子の高速 AFM 像を示す。高さ10 nm・幅 40 nm のナノ微粒子が明瞭に観測されている。カンチ レバー先端の曲率半径(15 nm)を補正すると,AFM 像 は10 nm サイズの立方体であることが分かる。

Pt 電極上の酸化被膜は 1.0 V (RHE)付近から生成し



始める。電位を 1.6 V (RHE)まで走査した場合,生成した酸化被膜は,0.4 V (RHE)以下の電位で完全に還元される。電位の下限を酸化被膜が完全に還元されない 0.6 V (RHE)とし,0.6 ~1.6 V (RHE)の範囲で電位走査を行ったところ,構造規制ナノ微粒子は溶解しなかった。

次に、電位の下限を酸化被膜が完全に還元される-0.05 V(RHE)とし、-0.05~1.6 V(RHE)の範囲で電位走査を行った。その際の立方体型 Pt ナノ微粒子の高速 AFM 像 を図 2 に示す。大きい球状のものは保護剤の PAA であり、小さい四角形状のものが 立方体型 Pt ナノ微粒子である。電位サイクル数が増加するにつれて、立方体型 Pt ナ

ノ微粒子のサイズが小さくなっており,溶解が進行していることが分かる。このことは,酸化被膜の還元が Pt ナノ微粒子の溶解引き起こしていることを示す。一方,電

位の上限が 1.3 V (RHE)以下では, Pt ナノ微粒子は溶解 しなかった。酸化被 膜の化学種は 1.3 V (RHE)では PtO, 1.6 V(RHE)では PtO<sub>2</sub>と されている<sup>6</sup>。以上 のことから, PtO<sub>2</sub>の 生成と還元が, Pt ナ ノ微粒子の溶解の 駆動力となってい ることが示唆され る。立方八面体型 Pt



ナノ微粒子でも同様の結果が得 られた。これらの AFM 測定結果 は Nishikata らの報告<sup>6</sup>を支持す る。

電位走査前の構造規制ナノ微 粒子の高さと幅を1に規格化し たナノ微粒子の電位サイクル依 存性を図3に示す。立方体型Pt ナノ微粒子の場合,サイクル数が 200回以上になると高さ・幅とも に急激に減少するのに対し,立方 八面体型の変化量は少ない。この 結果は,立方体型と比べて立方八 面型の耐久性が高いことを示し ている。



【謝辞】本研究は、NEDO・固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発/基盤技術開発/低白金化技術の委託を受けて実施された。

# 【文献】

- 1. R. M. Darling, J. P. Meyers, J. Electrochem. Soc. 150, A1523 (2003).
- 2. S. Motoo, N. Furuya, Ber. Bunsenges, Phys. Chem. 91, 457 (1987).
- 3. H. Kikuchi, W. Ouchida, M. Nakamura, C. Goto, M. Yamada, N. Hoshi, *Electrochem. Commun.* **12**, 544 (2010).
- 4. M. Yamada, S. Kon, M. Miyake, Chem. Lett. 34, 1050 (2005).
- T. S. Ahmadi, Z. L. Wang, T. C. Green, A. Henglein, M. A. El-Sayed, *Science* 272, 1924 (1996).
- 6. A. P. Yadav, A. Nishikata, T. Tsuru, J. Electrochem. Soc. 156, C253 (2009).

## 金基板上アゾベンゼン単分子膜の分子構造変化と表面形態制御

(東工大院・総理工<sup>1</sup>,東工大院・理工<sup>2</sup>,理研・揺律機能<sup>3</sup>)
石川 大輔<sup>1</sup>, Han Mina<sup>2</sup>,原 正彦<sup>1,3</sup>

【序】光によって分子構造,色,さらには物体の形状などが制御可能なスマートマテリアルの研究,開発は今後さらなる発展が期待される分野である.その一つとして我々は異なる波長の光を 照射することで分子構造変化(トランス シス異性化)を示すアゾベンゼンを,固体表面の修飾 手法として広く知られている自己組織化単分子膜(Self-assembled Monolayer: SAM)に導入するこ とによって,光のみで表面機能・形態を制御できる超薄膜の構築を目指している.アゾベンゼン は光刺激による可逆的な異性化反応と芳香環への置換基導入が容易に行えること,また SAM は金 属・非金属表面に高配向な分子層を簡便に作製できることが大きな特徴である.しかし従来のア ゾベンゼン分子で金基板上に SAM を形成した場合,SAM 中でアゾベンゼン分子が密に配列する ために異性化がほとんど起こらず,またシス体の熱力学的安定性が低いためにシス トランス異 性化が光照射せずとも非常に速く進行するため,SAM 中での異性化をいかに効率よく制御するか が課題とされていた.

近年,我々は SAM 中におけるアゾベンゼン分子の光異性化率向上とシス体の安定化のため,ア ゾベンゼンの芳香環に立体的に嵩高い置換基を導入した新規アゾベンゼン誘導体を設計・合成した.その SAM 中における異性化挙動を評価したところ,オルト位及びメタ位に置換基をもつアゾ

ベンゼンチオールは置換基をもたないものに 比べて SAM の光異性化率が高く,またシス体 をより長時間保てることが明らかとなった[1].

さらに SAM 中における分子の異性化挙動を 原子間力顕微鏡(AFM)や走査トンネル顕微 鏡(STM)で観察できれば分子構造変化の可 視化が可能となるが、このような前例はごくわ ずかであり現状では非常に困難であるといえ る[2].本研究では, Figure 1 に示す非対称アゾ ベンゼンジスルフィド(Et-2S)を用いて SAM 中アゾベンゼン分子の構造変化を SAM 表面形 態の変化として反映させ 観察することを試み た.



Figure 1 オルト位及びメタ位に置換基を 有する非対称アゾベンゼンジスルフィド (Et-2S)の分子構造.

【実験】Et-2S のジクロロメタン溶液に金基板を 24 時間浸漬することで SAM を作製した.作製 した Et-2S SAM について,異性化挙動を UV-vis 吸収スペクトル,水接触角測定から評価し,さら に SAM 中における分子の異性化に伴う表面形態変化を AFM(Nanoscope IV, tapping mode)で観 察した.なお異性化させるために照射した紫外光(365 nm)と可視光(436 nm)の強度はいずれ も 1 mW/cm<sup>2</sup>とした. 【結果と考察】Et-2S SAM に紫外光,可視光を照射 した後に吸収スペクトルを測定したところ,アゾベ ンゼンの π-π\*遷移に由来する 350 nm 付近の吸収帯 に繰り返し顕著な変化が現れた(Figure 2).また, Et-2S SAM 上における水接触角は SAM 作製直後に 93±1°を示し,紫外光照射後 87±1°まで低下,続 く可視光照射によって 91±1°に増加した.このと きの Et-2S SAM のトランス シス光異性化率は 87± 7%であり,これらの結果は SAM 中においてアゾベ ンゼン分子が可逆的に分子構造変化できることを示



Figure 2 系外元,可視元照射後の Et-2S SAM の UV-vis 吸収スペクトル.

している.さらに Et-2S とオルト位に置換基をもたない対照化合物のシス体の熱安定性を比較す ると,前者の方がよりシス体を長時間保持できることも明らかとなった.この要因はオルト位に 導入した置換基の嵩高さと,その立体障害によりアゾベンゼンが非平面構造となることが,SAM 中で異性化を妨げる強い分子間相互作用を緩和して高い異性化率をもたらすと同時にシス トラ ンス異性化における芳香環の回転・反転といった分子構造変化を阻害するためと考えられる[3].

Et-2S SAM の表面を AFM で観察したところ, Figure 3 (1)に示すような特異な worm-like 形態が SAM 表面全体に見られた.これに紫外光を照射すると worm-like 形態が消失し, 続いて可視光を 照射すると再び worm-like 形態が出現した (Figure 3 (2), (3)).このように worm-like 形態はトラ ンス体のときに出現し,シス体のときに消失していることから,この表面形態の変化はアゾベン ゼン分子のトランス シス異性化に対応していることがわかる.一方アゾベンゼン部位が同じ構 造をもつチオール分子では Et-2S のような worm-like 形態ではなく平坦な表面が一様に見られ,紫 外光,可視光照射時の形態変化も非常に乏しいことがわかった.したがって Figure 3 に示すよう な worm-like 形態の形成と光照射時の顕著な変化はジスルフィド SAM に特有の現象であり,Et-2S 分子が SAM を形成する際にジスルフィド結合が開裂することによって形成されるアゾベンゼン 部位とアルキル鎖部位の相分離構造に起因すると考えられる.



Figure 3 Et-2S SAM の(1)作製直後,(2)紫外光照射後,(3)可視光照射後における 表面形態変化.

#### 【参考文献】

[1] Han, M.; Ishikawa, D.; Honda, T.; Ito, E.; Hara, M. Chem. Commun. 2010, 46, 3598-3600.

[2] Pace, G.; Ferri, V.; Grave, C.; Elbing, M.; von Hanisch, C.; Zharnikov, M.; Mayor, M.; Rampi, M. A.; Samori, P. *Proc. Natl. Acad. Sci.U. S. A.* **2007**, *104*, 9937-9942.

[3] Ishikawa, D.; Honda, T.; Ito, E.; Han, M.; Hara, M. Jpn. J. Appl. Phys. 2010, 49, 06GH12 1-3.

2D05

 白金ステップ面における水分子水素結合異方性の O K-NEXAFS による研究 (東京農工大工<sup>1</sup>, KEK-PF<sup>2</sup>, 千葉大工<sup>3</sup>, 分子研<sup>4</sup>)
○遠藤 理<sup>1</sup>、中村 将志<sup>2</sup>、雨宮 健太<sup>3</sup>、小杉 信博<sup>4</sup>

[序] 遷移金属表面における水分子の水素結合形成は、燃料電池触媒や腐食等電極反応の素過程において重要である。Pt(111)表面では水分子はハニカム状に配列した bilayer を形成する[1]のに対し、ステップ面である Pt(211)表面ではステップ上に一次元的に zigzag に配列することが表面 X線回折の結果から明らかになっている[2]。本研究では一次元配列中の水素結合の状態を明らかにするため、酸素 K 吸収端の X 線吸収微細構造(O K-NEXAFS)スペクトルを測定した。

[実験] 超高真空下で Pt(211)を Ar<sup>+</sup>スパッタ、酸素アニール、フラッシュアニールにより清浄 化した後 110 K に冷却し、 $5 \times 10^8$  Torr で 200 s D<sub>2</sub>O を dose した。試料を 170 K まで昇温する ことにより単層以下の水を得た。O K-NEXAFS 測定は高エネルギー加速器研究機構・物質構 造科学研究所・放射光科学研究施設(KEK-PF)の、軟 X 線分光ステーション BL-7A において 110 K で部分電子収量法により行った。基板表面に対して偏光方向が平行な直入射(NI)、magic angle 入射(MI)、斜入射(GI)の入射条件で測定した。表面が鏡面対称であることから、偏光 方向の表面平行成分がステップ平行(//)な場合と垂直( $\perp$ )な場合の軸方向依存測定を行った。 構造モデルを得るための DFT 計算とスペクトル帰属のための内殻励起(GSCF3)計算を行った。

#### [結果と考察]

Pt(211)面に 110 K で形成した D<sub>2</sub>O multilayer の O K-NEXAFS スペクトルを図 1 a に示 す。NI および MI では、537.0 eV および 540.5 eV に大きなバンドが観測されているが、GI ではこれらの大きなバンドが見られない。また、どの条件でも 535.0 eV に小さな肩が観測さ れている。NI および MI のスペクトルの形状は bulk の氷のものに一致しており、これらの バンドは水素結合形成によってブロードになり高エネルギー側にシフトした 1s→o<sup>\*</sup>OHz、1s→ o<sup>\*</sup>OHx 遷移(x,z 軸は図 1 挿入図の通りに定義)がそれぞれ主に寄与している[3]。一方 535.0 eV に現れるバンドは、氷表面などで水素結合が切れた OH 結合の 1s→o<sup>\*</sup>OH 遷移に帰属される。 GI で氷のバンドがあまり観測されないことから、この multilayer では分子が x 軸を寝かせ た状態で凝集していることが示唆されるが、試料依存があり GI も NI と同様のスペクトルを 示す場合もある。

D<sub>2</sub>O multilayer/Pt(211)を 160 K まで昇温した試料の O K-NEXAFS スペクトルを図 1b、c に示す。表面 X線回折の結果から、この温度近辺ではステップ上の水のみが残ることが示さ れている[2]。図 1b はステップ平行、1c はステップ垂直条件でのスペクトルで、どちらも NI は multilayer のものと類似しており、面内で水素結合が保持されていることを示している。 また軸方向依存があまりないことから、一次元的な構造は示唆されない。GI では 533.0 eV と 538.5 eV にバンドが観測されており、Pt(111)面では同様のバンドがそれぞれ O-Pt 結合形 成に伴い生じた空状態、および白金表面の方向を向いた OD 結合に帰属されている[1]。図 1d は偏光方向がステップ垂直な条件でさらに試料を 10 K 昇温したものである。GI のスペクト ルが図 1b、c とほぼ同一であるのに対し、NI のスペクトルは大きく変化しており、540.5 eV のバンドが減少し 534.0 eV 付近で大きくバンドが成長している。後者のバンドは水素結合が 切れた OH 結合の 1s→o\*oH 遷移に帰属できることから、これらの変化はテラスの水が脱離す ることによりステップ垂直方向の水素結合が消滅した変化に対応すると考えられる。水分子 のテラスからの脱離はステップ上からの脱離の手前の比較的狭い温度域で起こることから、 ステップ上の水を作成する温度にばらつきがあると解釈している。

表面 X 線回折で得られた構造を出発モデルとし、DFT 計算による最適化を行ったところ、 ステップ上には 2 種類の吸着状態が存在し、それぞれ一方の水素をステップ垂直方向の山側 と谷側に向け、もう一方の水素でステップに沿った方向に水素結合を形成しているモデルが 得られた。水素結合距離は二者で異なり、それぞれ 3.22 と 2.76 Åであった。この一次元鎖モ デルに対し、白金表面を入れずに内殻励起計算を行ったところ、短い方の水素結合に対して 水素ドナーとなっている分子の free OH が一次元鎖垂直方向に 534.0 eV に大きく現れた。こ の結果は実験スペクトルをよく説明している。



図1。Pt(211)面におけるD<sub>2</sub>OのO K-NEXAFSスペクトル。(a)multilayer。(b)monolayer or step (||)。(c)monolayer ( $\perp$ )。(d)step ( $\perp$ )。

### [参考文献]

- 1. H. Ogasawara, et al., Phys. Rev. Lett., 2002, 89, 276102.
- 2. M. Nakamura, et al., J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 4538.
- 3. A. Nilsson, et al., J. Chem. Phys. 2005,122, 154505.

### チオフェン誘導体-Pt(111) 接合系における化学吸着誘起準位

(東大院・総合文化<sup>a</sup>, 横浜国大・工<sup>b</sup>, 阪大・工<sup>c</sup>) 〇佐藤博史<sup>a</sup>, 青木優<sup>a</sup>, 牛山翔太<sup>b</sup>, 菅原正<sup>a</sup>, 増田茂<sup>a</sup>, 首藤健一<sup>b</sup>, 柳澤将<sup>c</sup>, 森川良忠<sup>c</sup>

【序】分子デバイスの実現に向けて機能性有機分子-金属界面の電子構造や電荷輸送に関する研究が盛んに行われている.特に,金属-薄膜系の電荷注入障壁や,金属-分子-金属接合系の電気伝導特性などでは,界面の電子構造が本質的な役割を果たす.本研究では,Thiophene とこれを基本骨格にもつ Bithiophene, SH 基をもつ Thiophenethiol, Bithiophenethiol を取り上げ,準安定原子電子分光 (MAES)<sup>\*1</sup>,紫外光電子分光 (UPS),第一原理計算による電子状態の解析を行った.Pt (111) 基板上の多分子層及び単分子層について,結合状態や分子配向を明らかにすると共に,フェルミ準位 (*E*<sub>F</sub>) 付近に誘起される化学吸着誘起準位 (CIGS) について直接的な観測を行い,系統立てた考察を行った.

【実験・計算】 UPS と MAES の測定は超高真空(~10<sup>-8</sup> Pa)電子分光装置<sup>\*2</sup>を用いて行った. Pt (111) 基板は Ar<sup>+</sup> スパッタと加熱 (~ 900 K) を繰り返すことで清浄化し た.また,密度汎関数法による第一原理計算シミュレ ーションは STATE<sup>\*3</sup>プログラムを用いて行った.

【結果と考察】 図1 に各孤立分子でのエネルギー準 位を示す. Thiophene, Bithiophene / Pt(111) 系の MAES 測定結果を図2に示す. Thiophenen について, 基板温 度 55 K で作製した多分子層 (6ML) では孤立分子の分 子軌道(MO)に良く対応する価電子バンドが観測され た. 第一バンドは 1a<sub>2</sub>(π<sub>3</sub>)軌道(HOMO)であり, S 上 に節面をもつ. E<sub>F</sub>直下に構造がないので, 基板と直接 結合していない分子は絶縁体的な電子状態をとる.多 分子層を昇温すると,物理吸着分子が脱離し,高被覆 率(150K),低被覆率(200K)の単分子層を形成する<sup>\*4</sup>. これらの特徴は以下の通りである. i) Thiophene 由来 のバンドは多分子層から単分子層へ変化しても束縛 エネルギー( $E_{\rm B}$ )は大きく変化しないので、Pt(111)上 の Thiophene は弱く化学吸着する. ii ) 高被覆率単分 子層では He\*(2<sup>3</sup>S) 原子はペニングイオン化(PI) を経 て脱励起している.一方,低被覆率単分子層では PI 過程が強く抑制されオージェ中和(AN)+共鳴イオン 化(RI) が支配的である. この分岐比(Γ<sub>PI</sub>/Γ<sub>RI</sub>)の違いは 単分子層での分子配向の違いに依存している.つまり, 高被覆率では S を基板側へ向けて傾いた配向に由来 する PI 過程が、低被覆率では分子面が基板に対して 平行となり, He\*(2<sup>3</sup>S)原子の基板への接近に起因する



(B3LYP/6-311++G(d,p))



RI 過程が有利である. iii)両単分子層とも $E_{\rm F}$ 直下にCIGSに基づく構造が新たに観測されるため、 化学吸着した分子は金属的な電子構造をとる.

一方,Bithiophene について,基板温度 205K で作製した多分子層 (2ML) でもBithiophene 孤立分 子 MO に良く対応する.また  $E_{\rm F}$  直下に構造が無いことから物理吸着分子は絶縁体的な電子状態で ある.多分子層を 225K へ昇温すると、単分子層を形成する.多分子層と比べて  $E_{\rm B}$  は殆ど変化せ ず,Thiophene 同様に弱く化学吸着している.また、PI 過程が支配的であり、 $n_{\rm S}$  由来のバンド構 造も保存されていることから、分子は片方の環を真空側へ向け傾いた吸着構造をとることが解る. この様な He\* (2<sup>3</sup>S) 原子の基板への接近を困難にする嵩高い分子配向においても、 $E_{\rm F}$  直下には CIGS

が観測されるが、その強度はThiopheneの場合より弱い. 次に Thiophenethiol, Bithiophenethiol / Pt(111) 系の MAES 測定結果を図3 に示す. Thiophenethiol は 150 K で多分子層(2 ML)が形成された.エネルギー分裂 ( $\Delta E_{\pi 4 - \pi 3, 2} = 1.0 \text{ eV}$ ) は Thiophene ( $\Delta E_{\pi 3 - \pi 2} = -0.4 \text{ eV}$ ) と比 較して大きいことから, Thiophene π<sub>3</sub>-thiol S 3p は強く 混成している. 295K で物理吸着分子の脱離により化学 吸着分子による単分子層となる.特徴を以下に示す. i) Thiophene の場合とは異なり、多分子層から低  $E_{\rm B}$  へのシ フト(0.9-1.0 eV)が観測される.これは基板と強い thiolate 結合をしていることに対応する. また, PI 過程 が支配的であり、Thiophene 環を真空側へ向けた吸着構 造である. ii) HOMO と HOMO-1 のエネルギー間隔  $(\Delta E_{\pi 4 \pi 3})$ が多分子層と比べて殆ど変わらないことから, 強いThiophene 環 $\pi$ -S3p共役系はthiolate-Pt(111)結合 形成後も保存されている. iii) E<sub>F</sub> 直下に構造が観測さ れており, thiolate-Pt(111)界面における CIGS の存在を



示している.明確な Fermi edge 構造からも分子が金属的な電子状態をもっているといえる.

Bithiophenethiol でも 150 K で多分子層, 295 K で単分子層が観測された. Thiophenethiol と同様の描像が示された. 加えて, Thiophene 構造を 2 つもつ Bithiophene 構造の真空方向への大きな張り出しに由来する強い PI バンドが観測された.

上記の4種の系についてのまとめは以下の通りである.

- ① thiolate 結合の有無に関わらず、有機-金属界面で CIGS が形成される.
- ② 強い化学吸着系では分子由来のバンドが低 *E*<sub>B</sub> 側へシフトする. thiolate 結合を形成する場合は いずれも顕著であり、これは正孔の電荷注入障壁を大きく低下させることを示す.
- ③ 孤立系分子の MO が保存される傾向にある. Benzenethiol / Pt(111) 接合系では,孤立分子の MO に由来するπ電子構造に著しい変化が観測され<sup>\*5</sup>, π共役系内にS をもつ本系は,これと は対照的な描像である.
- 発表では第一原理計算の結果も踏まえてより詳細を報告する.
- \*1 Y. Harada, S. Masuda, H. Ozaki, Chem. Rev. 97, 1897 (1997).
- \*2 M. Aoki, Y. Koide, S. Masuda, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 156, 383 (2007).
- \*3 Y. Morikawa, Phys. Rev. B 51, 14802 (1995).
- \*4 J. Stohr et al. Phys. Rev. Lett. 53, 2161 (1984).
- \*5 S. Masuda et al. Phys. Chem. Chem. Phys. 12, 10914 (2010).

### 種々のチオール分子とトリチオシアヌル酸の

### 共吸着における自己組織化単分子膜

(日大院・生産工\*,日大・生産工\*\*)

○石塚 芽具美\*, 日秋 俊彦\*\*, 岡田 昌樹\*\*, 佐藤 敏幸\*\*, 大坂 直樹\*\*

【緒言】 単分子膜や多層膜における分子配向や水素 結合,表面金属との結合様式などは薄膜デバイス開 発において重要であり,研究も幅広く行われている. 薄膜の構造においては,化学結合はもちろん,薄膜 構成分子間の弱い結合も,分子内の結合角や結合距 離の変化に鋭敏に影響する.

これまでに、ポリマーと金属の接着剤などに用いられるトリチオシアヌル酸(TCA)(Fig. 1)の銀表面上における吸着で、トリチオン型(a)からトリチオール型(b)に変化し2つのチオール基で表面に吸着することを報告した[1].また、ベンゼントリチオール(BTT)(Fig.2)自己組織化単分子膜(SAM)中の分子の吸着構造をTCAと比較し報告した[2].

チオン型からチオール型に変化しながら吸着する TCAと、チオール型が安定なBTTにおいて、その吸 着能や吸着速度の違いに興味を持ち、TCAとBTTの





混合溶液を用いた SAM 膜作成を行い, その吸着膜を形成する分子の構造について赤外反射吸 収(IRAS) 法を用いて調べた. その結果, BTT が TCA の吸着を妨げることが明らかとなっ た[3,4,5]. その後, BTT が TCA の自己組織化を妨げる要因について, 他のチオール分子を用い ることでさらなる考察を行った. *o*-Mercaptobenzoic Acid (*o*-MBA) では自己組織化を妨げないの に対し, *p*-MBA と 5,6-Diamino-2,4-pyrimidinedithiol (DAPDT) では阻害される結果となった[6].

今回は、銀表面上の TCA と類似のチオール分子との共吸着における SAM 膜についてさらなる 検討を行った.

【実験】 0.25%のサンプル濃度の KBr 錠剤の赤外スペクトルを測定した. 目的のチオール分子は, *o*-MBA, *m*-MBA, *p*-MBA, DAPDT, 2,4-Diamino-6- dimercaptopyrimidine(2,4-DA6PT), 4,5-Diamino-2-dimercaptopyrimidine(4,5-DA2PT)等である.

共吸着膜については以下のように行った.鏡面研磨した銅基板の片面に厚さ約1000Åの銀を 真空蒸着した.この蒸着基板を,TCAと他のチオール分子を溶解した溶液に約4日間浸した. この基板を取り出しメタノールで洗浄し,SAM 膜を得た.作成した薄膜の IRAS スペクトル を測定した.バックグラウンドにはサンプルのついていない銀蒸着基板を用いた.使用し た分光器は、ブルカー・オプティクス社製 FT-IR の IFS 125HR および IFS 66v/S である.分 解能は4 cm<sup>-1</sup>で、検知器には IRAS 法には MCT を,KBr 錠剤法には DTGS を用いた.積算 回数は IRAS 法は 1000 回,KBr 錠剤法は 500 回とした.



m-MBA, (c) *p*-MBA の赤外スペクトル

Fig. 2 KBr 錠剤中の(a) DAPDT,(b) 2,4-DA6PT,(c) 4,5-DA2PT の赤外ス ペクトル

また、DFT 法による構造最適化および基準振動数計算も併せて行った.

【結果】Fig.1に, o-MBA, m-MBA, p-MBAの, Fig.2には DAPDT, 2,4-Diamino-6dimercaptopyrimidine (2,4-DA6PT), 4,5-Diamino-2-dimercaptopyrimidine (4,5-DA2PT)の KBr 錠 剤スペクトルを示す. このことにより,それぞれの分子本来のスペクトルの強度を確認し, 共吸着させたときにそれぞれの分子がどの程度の割合で吸着しているのかを知るための指標 とした. それぞれの分子は, 10<sup>-1</sup>または 10<sup>-2</sup>の ABSORBANCE 強度で現れた.

講演当日には, 共吸着の IRAS スペクトルや, DFT 法による構造最適化および基準振動数 計算の結果も交えて報告する.

【参考文献】[1] Osaka N., et al, J. Mol. Struct., 921, (2009), 144. [2] 石塚芽具美ら,第2回分子科学討論会 2008 福岡, 3P091(2008) [3] 石塚芽具美ら,第3回分子科学討論会 2009 名古屋, 2P073(2009) [4] 石塚芽具美ら,日本化学会第90春季年会,1C5-43(2010) [5] Ishitsuka M., et al, J. Mol. Struct., 印刷中 [6] 石塚芽具美ら,日本化学会第91春季年会,3F2-47(2011)

### 光刺激脱離条件下における CO/Cu(100)の振動ダイナミクス

(京大院・理) 〇井上 賢一, 渡邊 一也, 松本 吉泰

【序】金属表面上の吸着系では、基板である金属が連続的な電子状態を持つため、吸着種の 運動と金属中の電子励起(電子-正孔対生成)とが強く結合しているという大きな特徴がある。 その結果、高強度の超短レーザーパルスを照射すると、高温の基板電子によって吸着分子の 振動が励起され、拡散や脱離が非常に効率よく引き起こされる。従って、金属表面上での反 応の理解には吸着種の運動の詳細を知ると共に、それらがどのように金属電子と相互作用し ながら運動しているのか、といった固体表面における電子-格子相互作用を明らかにするこ とが不可欠である。我々は、これまで、CO/Pt(111)においてヘテロダイン検出和周波発生振 動分光法(Heterodyne-detected Sum Frequency Generation; HD-SFG)を用いて CO の振動 緩和過程や脱離前駆状態の観測などの光刺激脱離条件下におけるダイナミクスの解明に取り 組んできた。CO/Cu(100)は、(111)表面と異なり吸着サイトが on-top サイトのみであること から単純な系であり、また理論計算による電子-格子相互作用のパラメータに関する先行研 究が豊富である。

【実験・解析】図 1 に光学系の略図と実験におけるパルスタイミングを示す。通常の手順で 清浄化した Cu(100)単結晶表面に 100 K付近で CO を曝露して測定を行った。測定には Pump (400 nm, 150 fs)、IR パルス (2080 cm<sup>-1</sup>, 150 fs)、800 nm 可視光 (800 nm, 1.0 ps)の 3 つの

パルスを用いており、IR パルスと可視 光のピーク間遅延時間は600 fsとした。 実験はホモダイン検出とヘテロダイン 検出の2通りの検出方法を用いた。ホ モダイン検出では、既報の超高真空下 TR-SFG 測定システムを用いて Pump-IR パルス間遅延時間 (td)の関 数として時間分解測定を行った[1]。一 方、ヘテロダイン検出では、Cu 基板か らの SFG を真空槽外で BBO (Local oscillator)から発生させた SFG との干 渉信号を CCD により検出し、楔形の BaF2の光路への挿入距離 d を変化さ せながら taの関数として時間分解測定 した。 信号の 解析は、 R. Superfine ら の手法に従った[2]。真空槽中の試料を GaAs に置き換えて得た参照信号との 比を取ることで、試料の非線形感受率



χ<sup>(2)</sup>の振幅と位相に関する情報が得られる。また、光刺激脱離条件下では、真空槽内に CO を 1×10<sup>-7</sup> Torr 満たして測定中の平均被覆率が一定になるようにした。

【結果と考察】図2にホモダイン検出 時間分解測定における C-O 伸縮振動 数の ta 依存性を示す。振動数は、200 ~300 fs で急激なレッドシフトを示し、 数 ps かけて元の振動数に戻る。この振 動数変化を、C-O 伸縮振動と束縛並進 (Frustrated translation; FT)モード・ 束縛回転(Frustrated rotation; FR)モ ードとの非調和結合によるシフトを基 に再現するシミュレーションを行った。 その結果、FT モードだけではなく FT・FR モードの両方を考慮すること によって定性的に実験結果を再現する ことができた。

また、図3にはヘテロダイン検出測定 を用いて得られたχ<sup>(2)</sup>の実部と虚部の 時間分解スペクトルを示す。励起光入 射により、C-O伸縮振動バンドにレッ ドシフトとブロードニングが観測され、 これらのスペクトル変化はサブピコ秒 スケールの吸着種-基板間振動のダイ ナミクスを反映していると考えられる。

【参考文献】[1] M. Nagao, K. Watanabe and Y. Matsumoto, *J. Phys. Chem. C* **113**, 11712 (2009) [2] R. Superfine, J. Y. Huang and Y. R. Shen, *Opt. Lett.* **15**, 1276 (1990)



TiO2 光触媒反応における結晶面選択性の単一分子蛍光観察

(阪大産研) 〇立川 貴士, 山下 聡一朗, 真嶋 哲朗

【序】 二酸化チタン (TiO<sub>2</sub>) ナノ粒子は、環境浄化型光触媒や機能性コーティングなど様々 な分野で実用化されている重要な機能性材料である[1]。近年、より高活性かつ高選択的な光 触媒を開発するため、特定の結晶面を有する TiO<sub>2</sub>結晶の合成が注目されている[2]。これまで も結晶面による反応性の違いが指摘されてきたが、通常のバルク測定では表面反応のみを評 価することが困難であるため、未だ明確な結論は得られていない。そこで本研究では、単一 分子蛍光分光法[3]を用いて、アナターゼ型 TiO<sub>2</sub>結晶における光触媒還元反応を単一分子レベ ルでその場観測し、反応における結晶面選択性を明らかにすることを目的とした。

#### 【実験】

還元反応を選択的に検出するための蛍 光プローブには、フルオロフォアとして BODIPY を、還元反応部位としてジニト ロフェニル基を有する 3,4-dinitrophenyl-BODIPY

(DN-BODIPY) を用いた[4]。
DN-BODIPYは、図1に示したように、
ジニトロフェニル基のひとつのニトロ基が多電子的に還元されることで、強蛍光



**Fig. 1.** Generation of fluorescent HN-BODIPY from nonfluorescent DN-BODIPY during TiO<sub>2</sub> photocatalytic reduction reactions.

性の 4-hydroxyamino-3-nitrophenyl-BODIPY (HN-BODIPY) を生成する。

(001) 面および(101) 面からなるアナターゼ型 TiO<sub>2</sub>結晶は、Ti 前駆体と結晶成長抑止剤である HF を含む水溶液の水熱反応によって合成した(図 2A) [4]。TiO<sub>2</sub>結晶を固定化したカバ ーガラスをフローチャンバーに設置した後、アルゴンガスを飽和させた DN-BODIPY メタノ ール溶液を注入し、観察試料とした。

単一分子蛍光観察は全反射蛍光顕微鏡(Olympus IX71)を用いて行った。蛍光色素および TiO<sub>2</sub>の励起には、それぞれ連続波レーザー(488 nm)および LED 光源(365 nm)を用い た。検出器には、高感度 EM-CCD カメラを用いた。

【結果と考察】 TiO<sub>2</sub>結晶に紫外光を照射することで、蛍光プローブの蛍光性生成物である HN-BODIPYの単一分子蛍光が結晶上で観測された(図 2B)。観測された蛍光輝点の中心位 置を解析することで、反応活性サイトの空間分布について調べた。図 2C に示したように、 {101}面では{001}面と比べ、単位面積あたりより多くの反応活性サイトが存在していることが わかった。これまで不均一触媒における表面反応では、表面エネルギーの高い結晶面でより 反応が進行しやすいと考えられてきた。しかしながら、アナターゼ型 TiO<sub>2</sub>の{101}面は{001} 面より表面エネルギーが低いた め、表面エネルギーの差のみで A 反応活性の違いを説明できない。

分子吸着のダイナミクスにつ いての知見を得るため、反応頻 度および蛍光輝点の持続時間

(τon)の蛍光プローブ濃度依存
性について検討した。その結果、
反応頻度は蛍光プローブの濃度
増加に伴って増加し、

Langmuir-Hinshelwood の式に 従うことがわかった。個々の結



Fig. 2. (A) Structure of anatase  $TiO_2$  crystal with preferential {001} facets. (B) Fluorescence image of a single  $TiO_2$  crystal on the cover glass in Ar-saturated methanol containing DN-BODIPY under 488 nm laser and UV irradiation. (C) Transmission image of the same crystal. The open and filled circles in image C indicate the fluorescence bursts located on the {101} and {001} surfaces, respectively, observed during 3 min irradiation.



**Fig. 3.** DN-BODIPY concentration dependence of  $<\tau_{on}>^{-1}$  obtained for the {001} (open circles) and {101} (filled circles) facets of a single TiO<sub>2</sub> crystal.

ものの、平均的には{101}面と{001}面に大きな差はみ られなかったことから、分子吸着の違いにより反応 活性が異なっているのではないことが推測される。 一方、図 3 に示したように、生成物の解離速度に対 応するτon<sup>-1</sup>の蛍光プローブ濃度依存性では結晶面に

晶によって、吸着の平衡定数の値にばらつきがある

よる顕著な違いがみられた。解析の結果、{001}面で は生成物である HN-BODIPY が異なる吸着サイトを 介して溶液中へ解離することが示唆された。

半導体光触媒では、光照射によって生成した電子もしくはホールが表面まで拡散し、吸着分子と反応

する。本系では、ホールは溶媒であるメタノールに捕捉され、伝導帯に生じた電子が DN-BODIPY のニトロ基を還元する。したがって、{101}面の伝導帯準位が{001}面のそれよ り低い場合、異方的な電子の流れが生じると期待される。この仮説を確認するため、{001}面 への選択的な紫外光照射を行い、蛍光観察を行った。その結果、励起されていない{101}面上 でも多くの蛍光輝点が観測された。一方、{101}面を選択的に励起した場合、照射位置でのみ 蛍光輝点が観測された。以上の結果から、観測された光触媒反応の結晶面選択性は、主に、 結晶面による伝導帯準位の違いに起因する電子捕捉効率の違いによるものと結論した[5]。

### 【参考文献】

[1] A. Fujishima, X. Zhang, D. A. Tryk, Surf. Sci. Rep., 2008, 63, 515–582.

[2] G. Liu, J. C. Yu, G. Q. Lu, H. M. Cheng, Chem. Commun., 2011, 47, 6763-6783.

[3] T. Tachikawa, T. Majima, Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 4802–4819.

- [4] T. Tachikawa, N. Wang, S. Yamashita, T. Majima, Angew. Chem. Int. Ed., 2010, 49, 8593-8597.
- [5] T. Tachikawa, S. Yamashita, T. Majima, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 7197-7204.

### 非晶質高分子固体中単ーゲスト分子の異常拡散と拡散係数の空間相関

(<sup>1</sup>阪大院基礎工・阪大極量セ、<sup>2</sup>富山県立大工、<sup>3</sup>JST CREST) ○伊都将司<sup>1</sup>・前田健太郎<sup>1</sup>・竹井敏<sup>2</sup>・宮坂博<sup>1,3</sup>

【序】ポリマー等の非晶質凝縮相固体中のミクロスコピックな環境が場所により異なることは一般によ く知られた事実である。このような非晶質高分子固体のミクロスコピックな不均一性の解明には、 spectral hole burning、fluorescence line narrowing、photon echo などの分光手法を用いた研究がなさ れてきた。しかしこれらのアンサンブル計測では、ゲスト分子の電子遷移に与える周辺微環境の不均 一性に関して平均化された情報を得ることは可能であるが、数ナノメーターからマイクロメーター程度 のサイズの不均一性など、場所や空間サイズに依存した知見を得ることは困難である。

凝縮相固体中では内在するミクロ不均一性のため、ゲスト分子のエネルギー準位や輻射・無輻射 遷移の速度定数は分子ごとに異なり、またゲスト分子の並進・回転拡散速度も分子を取り巻くナノ環 境に強く依存する。近年我々はゲスト分子の挙動を一個一個詳細に観測、解析することで、ホスト材 料のナノ構造、局所物性などを高い時空間分解能で、原理的には in situ で評価可能であることを指 摘し、メソポーラス有機シリカ系材料や架橋高分子などを対象に研究を展開してきた[1-5]。今回はナ

ノスケール不均一性に関する情報をより定量的に解明す ることを目指し、時間分解能を向上させた測定装置を用 いゲスト分子の拡散挙動をより詳細に測定・解析し、並進 拡散係数に現れる不均一性を種々の解析法を用い評価 した。

【試料と実験】試料には実際の半導体加工プロセス等で も使用される poly(2-hydroxyethyl acrylate) (polyHEA)を 主として用いた。polyHEA の乳酸エチル溶液に、ゲスト蛍 光色素としてペリレンビスイミド誘導体を微量添加し、その 溶液をガラス基板上にスピンキャストすることで厚さ数十 ~数百 nm の polyHEA 薄膜を得た。CW レーザー光(波 長 488nm)を対物レンズ(×100, NA1.35)を介し落射配置 でサンプル薄膜に均一に照明し、従来と比べて 10 倍以 上の時間分解能である露光時間 31ms で試料薄膜からの 単分子蛍光像を取得した。画像解析により各蛍光像にお ける単一ゲスト分子の位置を 10 nm 程度の精度で追跡し、



図1. ゲスト蛍光分子イメージング(左上)、画像解析結果(右上)と並進拡散 の軌跡(下)の例。

その時間変化から並進拡散の軌跡を得た。

【実験結果と考察】測定結果の一例 を図1に示す。フレーム間隔(31 ms) あたりの変位は図1下図の下部中央 周辺では短く、一方中~上部では比 較的長く、ゲスト分子が存在する領域 により異なる値を示すことがわかる。 他の分子を観測した場合にも同様の 挙動が得られ、単位時間あたりの変 位の小さい部分と大きい部分は、そ れぞれ数十から数百 nm 程度のサイ ズであった。



図2.累積確率による解析結果の例。

この不均一性をより定量的に解析するために、変位  $r^2$ とその時間間隔 tの関係  $C(r^2, t)$ (累積確率) を求めた。図2にその解析結果の例を示す。均一な媒体における累積確率は1つの Gauss 分布を示 すが、図2から明らかなように、測定結果は1つの Gauss 関数では再現できず、2 成分の Gauss 分布 を仮定するとよく再現された。また、並進拡散速度の速い成分、遅い成分それぞれの平均二乗変位 < $r^2(t)$ > と時間間隔 tの間には、線形の関係が得られたことから、本研究で用いた polyHEA 薄膜では、 PBI 分子が早く拡散できる領域と、拡散の遅い領域の2 つに大別できると結論した。

多数個のゲスト分子に対して上記と同様の解析を行い、早い拡散成分、遅い拡散成分それぞ れに対して拡散係数のヒストグラムを得た。速い成分と遅い成分の拡散係数は10倍以上異な り、またそれぞれに分布が存在した。特に速い成分に対応する大きな拡散係数の分布は幅広 く、これはµmサイズの領域の高分子密度や運動性の差異を示唆する。各分子の示した2成分 の拡散係数間での相関を多数のゲストに対してプロットしたところ、データにばらつきはあ るが正の相関を示した。講演ではこのデータに関して深く議論すると共に、重合度依存性、 膜厚依存性などについても議論する。

#### 参考文献

[1] Syoji Ito, Takatsugu Kusumi, Satoshi Takei, and Hiroshi Miyasaka, *Chemical Communications* **2009** pp6165-6167.

[2] Syoji Ito, Kou Itoh, Smritimoy Pramanik, Takatsugu Kusumi, Satoshi Takei, and Hiroshi Miyasaka, *Applied Physics Express* **2009**, 2, 075004.

[3] 伊都将司:分光研究,第58卷6号,pp259-267 (2009).

[4] 伊都将司、宫坂 博:化学, Vol.65, No. 1, pp38-43 (2010).

[5] 伊都将司、宫坂 博:高分子, Vol.60, pp54-57 (2011).